

EV Group announces NanoCleave layer release new technology revolutionizing 3D Integration for advanced packaging and transistor scaling – January 30, 2024

EVG introduced NanoCleave™, a revolutionary layer release technology for silicon that enables ultra-thin layer stacking for front-end processing, including advanced logic, memory and power device formation, as well as semiconductor advanced packaging. NanoCleave is a fully front-end-compatible layer release technology that features an IR laser that can pass through silicon, which is transparent to the IR laser wavelength. NanoCleave enables silicon wafer carriers in advanced packaging processes such as FoWLP using mold and reconstituted wafers as well as interposers for 3D SIC. At the same time, its compatibility with high-temperature processes enables completely novel process flows for 3D IC and 3D sequential integration applications. EVG's new NanoCleave technology utilizes an IR laser and inorganic release materials to enable laser debonding on silicon with nanometer precision.



나노클리브는 EMC (epoxy mold compounds)와 재구성 웨이퍼(reconstituted wafer)를 사용하는 팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징 (FoWLP)부터 3D SIC (3D Stacking (C)의 인터모저 같은 첨단 패키징 공정에서 실리콘 웨이퍼 캐리이 사용을 가능하게 한다. 이 뿐만 아니라, 고은 공정에도 적용할 수 있어 3D IC 및 3D 순자 점직 애플리케이션에서 원전히 새로운 공정 플로를 구현할 수가 있다. 이는 실리콘 캐리어 상의 초박형 레이아까지도 하이브리드 및 퓨전 본딩이 가능해 3D 및 이종 집적에 핵신을 가져다를 뿐 안 아니라, 자세대 트랜지스터 집적확 설계에서 필요한 레이어 이용을 가능하게 한다.

EVG는 코엑스에서 1월 31일부터 2월 2일까지 개최되는 SEMICON 코리아 2024 전시회에 참가해 나노글리브 신기술을 소개한 다. EVG 부스(무스 변호: D832, 3중)를 방문하면 EVG 임원들을 직접 만나서 이 역신적인 적외선 레이저 이중 기술에 관해 논의 항 수 있다.

◇ 3D 적층 및 후공정에서 실리콘 캐리어 사용의 이점

3D 집작에서는 인터커넥션 대역목이 접접 더 높아지면서 더 고성능의 시스템을 구현할 수 있도록 박형 웨이퍼 공정을 위한 캐리어 기술이 중요하다. 이를 위해 기존 주류 기법들은 유리 캐리어를 사용한다. 이 기법은 유기 점착제를 이용해 입시 본당을 해서 디바이스 레이어를 정성한 다음, 자전선(UV) 파장 레이저를 사용해서 접착제를 용해시기고, 디바이스 레이어를 분리한 후 최종 완성품 웨이퍼 상에 영구적으로 본당한다. 하지만 유리 기판은 실리콘 위주로 설계된 반도체 제조 장비를 사용해서 처리하기가 마다롭고, 유리 웨이퍼를 처리한 수 있도록 업그레이드하려면 비용이 많아 든다. 이뿐만 아니라 유기질 접착제는 동상적으로 300°C 이하 처리 온도로 사용이 제한되므로, 후공정에 사용하기에 한계가 있다.

나노클리브 기술은 무기 박막을 활용하는 실리콘 캐리어를 사용할 수 있어 이런 온도 한제와 유리 캐리어의 호현성 이슈를 피할 수 있다. 또 IR 레이저를 사용해서 나노미터 정말도로 클리빙어 가능하므로 기존 공정을 변경하지 않고서 초박형 디바이스 쉐이 퍼플 저리할 수 있다. 이어래 만들어진 초박형 디바이스 레이어를 적중하면 너 높은 대역쪽의 인터커넥트를 구현할 수 있으며, 차세대 고성능 시스템을 위한 다이를 설계 및 새부화하기 위한 새로운 기회를 만들 수 있다.

○ 차세대 트랜지스터 노드에 요구되는 새로운 레이어 이송 프로세스

트렌지스터 로드템이 3mm 이하 노드로 진회함에 따라 매립형 전원 레잌, 후면 전원 공급 네트워크, 상보성 FET(CFET), 2D 원자 채널 같은 새로운 아기역처와 설계 혁신이 필요해졌다. 이런 모든 기법에는 극히 얇은 소재의 레이어 이승이 요구된다. 실리콘 캐리어와 무기 박막은 전 공정 제조 물론을 위한 프로세스 성결성, 소재 호환성, 높은 저리 온도 요건물 지원한다. 지금까진 실리 콘 캐리어가 그라인당, 연마, 식각 공정을 거쳐서 완벽하게 제거돼야 했지만, 이는 작업 중인 디바이스 레이어의 표면에 마이크 콘 배의 자이를 유발하므로 참단 트랜지스터 노드의 박형 레이어 적승에 사용하기에는 적합하지 않았다.

EVG의 새로운 나노글리브 기술은 적왜한 레이저와 무기 박막을 사용하므로 실리콘상에서 나노미터 정밀도로 레이저 디온딩이 가능하다. 이는 점단 패기정 공정에서 유리 기반을 사용할 필요가 얇게 해 온도 한의와 유리 개리이 호현성 문제를 피할 수 있다. 해주다. 기존 공장을 변경하지 않고도 전 공정에서 개리어를 통해 초박영한 자꾸는 마이크로 10 이하 레이어를 이송할 수 있다. 이런 나노미터대 정밀도를 지원하는 EVG의 새로운 프로시스는 더 않은 디바이스 레이어와 패키지가 필요한 첨단 반도체 디바 이스 로드램의 모구를 중독하고, 향상된 이중 집작을 가능하게 하며, 유리 기반 사용 필요성 제거 및 박막 레이어 이송 가능성을 통해 공정 비용을 결강할 수 있게 해준다.

EVG 그룹의 기술 이사 풀 런드너(Paul Lindner)는 "반도체 공정 노드를 축소하기가 갈수록 더 복잡하고 어려워지고 있다. 공정 노드를 축소하려면 프로세스 허용 공차 또한 점점 더 불어들기 때문이다. 업계는 더 높은 집적도와 더 높은 디바이스 성능을 달 한 반도체 크기 축소에서 게임 체인제가 들 것이다. 반도체업계에서 가장 압반이 신한 요구 사망들을 해결할 장제객을 갖추고 있다. 나노글리브는 묘준 실리콘 웨이퍼 및 웨이퍼 공정들과 호현되는 유연하고 범용성이 뛰어난 레이어 탈리즈 기술을 통해 우 리 교객이 참단 디바이스 및 패기정 로드앱을 실현할 수 있게 지원할 것이며, 고객들은 이 기술을 자신들의 기존 팬에 지체없이 통합하고 시간과 비용을 참간할 수 있을 것"이라고 말했다.

○ 차별화된 IR 레이저 기술

EVG의 나노글리브 기술은 실리콘을 두파하는 고유의 파장을 사용해 실리콘 웨이퍼 뒷면을 적외선 레이저에 노출시킨다. 표준 중착 궁정으로 형성된 무기 박막이 IR 광을 흡수함으로써 사전에 정말하게 지정된 레이어나 면적으로 실리콘을 분리시킨다. 무 기 박막을 사용함으로써 중 더 정말하고 얇은 레이어를 사용할 수 있다.유기 점착제를 사용할 때 수 마이크콘대였던 것에 비해 수 나노미터대로 잃아진. 뿐만 아니라 무기 박막은 고온 공장(취대 1000°C)과 호환할 수 있으므로 에피택시, 중착, 이닐링처럼 용기 점착제를 사용할 수 있는 많은 새로운 전 공정 애플리케이션에서 레이어 이용을 가능하게 하다.

◇ 제품 공급

EVG의 나노클리브 기술은 현재 EVG 본사에서 데모가 가능하다.

https://www.reporternside.com/ press/?newsid=983413